



涂镀层测厚仪

MINITEST 1100/2100/3100/4100



ElektroPhysik

德国 EPK 公司专业制造覆层测厚仪、表面检测仪器

China Marketing: 010-82951585; 010-82946733; 4000240008

涂镀层测厚仪 MINITEST 1100/2100/3100/4100

仪器特点

德国 EPK 公司 MINITEST 4100/3100/2100/1100 系列包括四种不同的主机，各自具有不同的数据处理功能。主机可通过 RS232 接口连接 MINIPRINT 打印机和计算机，所有型号的主机均可配所有探头。在选择探头时需要考虑覆层厚度，基体材料以及基体的形状、厚度、大小、几何尺寸等因素。其中：

F 型探头：测量钢铁基体上的非磁性覆层

N 型探头：测量有色金属基体上的绝缘覆层

FN 两用探头：同时具备 F 型和 N 性探头的功能

技术特征

	1100	2100	3100	4100
MINITEST 存储的数据量				
应用行数(根据不同探头或测试条件而记忆的校准基础数据数)	1	1	10	99
每个应用行下的组(BATCH)数(对组内数据自动统计计算,并可设宽容度极限值)		1	10	98
可用各自的日期和时间标识特性的组数		1	500	500
数据总量	1	10000	10000	10000
MINITEST 统计计算功能				
读数的六种统计值x,s,n,max,min,kvar		✓	✓	✓
读数的八种统计值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk			✓	✓
组统计值六种x,s,n,max,min,kvar			✓	✓
组统计值八种x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk			✓	✓
存储显示每一个应用行下的所有组内数据				✓
分组打印以上显示和存储的数据和统计值			✓	✓
显示并打印测量值、打印的日期和时间		✓	✓	✓
其他功能				
设置极限值			✓	✓
连续测量模式快速测量,通过模拟柱识别最大最小值			✓	✓
连续测量模式中测量稳定后显示读数			✓	✓
连续测量模式中显示最小值			✓	✓

可选探头参数

探头	F05	F1.6	F1.6/90	F3	F10	F20	F50	FN1.6	FN2	N.08Cr	N02	N1.6	N1.6/90	N2	N10	N20	N100	CN02
测量范围	0~500μm	0~1600μm	0~1600μm	0~3000μm	0~10mm	0~20mm	0~50mm	F:0~1600μm N:0~1600μm	F:0~3000μm N:0~2000μm	0~80μm	0~200μm	0~1600μm	0~1600μm	0~2000μm	0~10mm	0~20mm	0~100mm	0~200μm
分辨率	0.1μm	0.1μm	0.2μm	0.2μm	5μm	10μm	5μm	0.2μm	0.2μm	0.1μm	0.2μm	0.1μm	0.1μm	0.2μm	10μm	10μm	0.1mm	0.2μm
精度	±(1%+0.7μm)	±(1%+1μm)	±(1%+1μm)	±(1%+1μm)	±(1%+10μm)	±(1%+10μm)	±(3%+50μm)	±(1%+1μm)	±(1%+1μm)	±(1%+1μm)	±(1%+0.5μm)	±(1%+1μm)	±(1%+1μm)	±(1%+1μm)	±(1%+25μm)	±(1%+50μm)	±(1%+3mm)	±(1%+0.3μm)
最小曲率半径	凸1mm 凹5mm	凸1mm 凹5mm	平直 凹6mm	凸1.5mm 凹10mm	凸5mm 凹16mm	凸10mm 凹30mm	凸200mm 凹50mm	凸1.5mm 凹10mm	凸1.5mm 凹10mm	2.5mm	凸1mm 凹10mm	凸1.5mm 凹10mm	平直 10mm	凸1.5mm 凹10mm	凸25mm 凹100mm	凸25mm 凹100mm	平直 100mm	平直 表面
最小测量面积	直径3mm	直径5mm	直径5mm	直径5mm	直径20mm	直径40mm	300x300mm	直径5mm	直径5mm	直径2mm	直径2mm	直径2mm	直径5mm	直径5mm	直径50mm	直径70mm	直径200mm	直径7mm
最小基体厚度	0.2mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm	1mm	2mm	2mm	F0.5mm N50μm	F0.5mm N50μm	100μm	50μm	50μm	50μm	50μm	50μm	50μm	50μm	无限制

注: F1.6/90和N1.6/90为90度探头,用于管内测量; FN1.6/FN2为铁基体和非铁基体通用; N100用于测量铁基体和非铁基体上的绝缘层; N.08Cr适合铜上铬; CN02用于测量绝缘材料上的有色金属镀层

